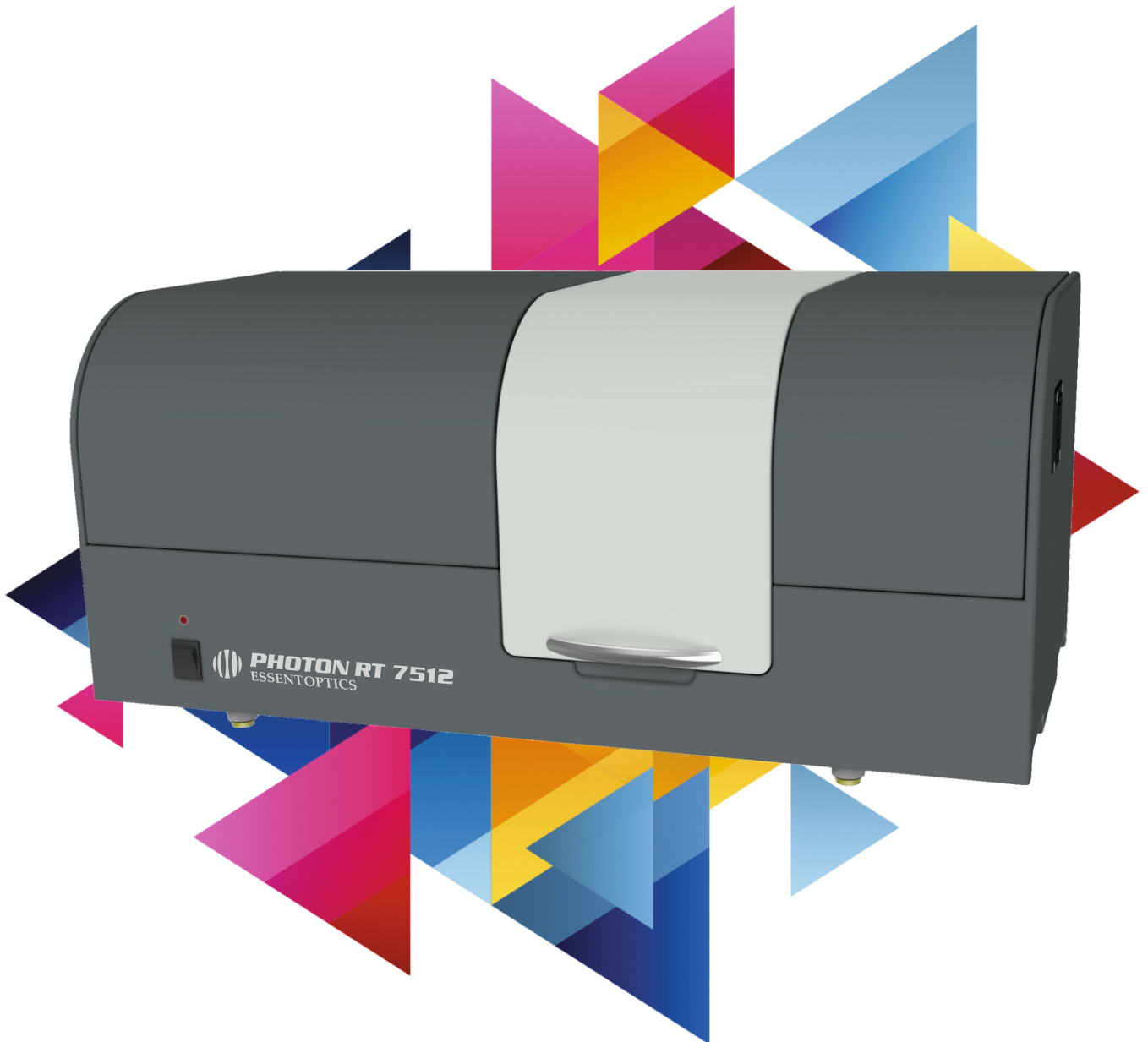




OUTSTANDING SPECTRAL MEASUREMENTS OF OPTICAL COATINGS

# ***PHOTON RT 7512***

LWIR SPECTRAL MEASUREMENTS OF PLANO OPTICS AND PRISMS



# SPECIFICATIONS

| PARAMETER                                                     | DESCRIPTION                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MODEL</b>                                                  | <b>7512</b>                                                                                                                              |
| <b>OPTICAL CONFIGURATION</b>                                  |                                                                                                                                          |
| Photometric functions                                         | %T, %R                                                                                                                                   |
| Effective wavelength range, $\mu\text{m}$                     | 7,5 – 12,5                                                                                                                               |
| Built-in polarizers, $\mu\text{m}$                            | 7,5 – 12,5                                                                                                                               |
| Optical scheme of monochromator                               | Czerny-Turner                                                                                                                            |
| Optics                                                        | Mirror: Au, Lenses: ZnSe + AR                                                                                                            |
| Measurement of Transmission                                   | Variable angle measurements:<br>0 – 60 deg angles of incidence                                                                           |
| Measurement of Reflection                                     | Interchangeable sample stages<br>with fixed angles of incidence: 10, 30, 45 and 60 deg<br>Reference sample: gold mirror                  |
| Turning pitch angle of sample stage                           | 0,01 deg                                                                                                                                 |
| Beam displacement compensation, mm                            | 40                                                                                                                                       |
| Unattended polarization measurements with built-in polarizers | S, P, (S+P)/2                                                                                                                            |
| Wavelength sampling pitch, nm                                 | 0,5 – 100,0                                                                                                                              |
| Spot size on measured sample, mm                              | 6,0 x 3,0                                                                                                                                |
| Ultimate spectral resolution, nm                              | 8 (non-polarized light)                                                                                                                  |
| Wavelength accuracy, nm                                       | 3,6                                                                                                                                      |
| Wavelength repeat accuracy, nm                                | +/- 0,9                                                                                                                                  |
| Photometric accuracy                                          | +/- 0,2 % (47% T, $\lambda_0 = 10,6\mu\text{m}$ , AOI = 3°)                                                                              |
| Photometric repeat accuracy                                   | +/- 0,1 %                                                                                                                                |
| Stability of baseline (UV-VIS), %/hour*                       | +/- 0,3 %                                                                                                                                |
| Light sources                                                 | IR lamp<br>HgAr wavelength calibration verification lamp                                                                                 |
| <b>SAMPLE COMPARTMENT</b>                                     |                                                                                                                                          |
| Maximum sample size, mm                                       | 150 x 200                                                                                                                                |
| Maximum sample thickness, mm                                  | 40                                                                                                                                       |
| Planar sample stage                                           | For measurement of transmission and<br>reflection of planar samples<br>with size bigger than 12 x 10 mm                                  |
| Synchronized positioning                                      | Synchronized computer controlled positioning<br>for sample stage and photodetectors unit<br>depending on the chosen photometric function |
| <b>INTERFACE, DIMENSIONS AND WEIGHT</b>                       |                                                                                                                                          |
| Interface                                                     | USB 2.0                                                                                                                                  |
| Power consumption, Watt                                       | 110                                                                                                                                      |
| Power input                                                   | 110 – 220 VAC, 50 – 60 Hz                                                                                                                |
| Width x Depth x Height, mm (inches)                           | 760 x 340 x 370 (30" x 13,39" x 14,57")                                                                                                  |
| Net weight, kg (lbs)                                          | 51 (112)                                                                                                                                 |

\* after 1 hour warm-up time



グローバルにネットワークを広げ、最先端の科学をお客様に提供

本 社：〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-18-14 T.I.ビル

Tel. 03-3686-4711

営業所：〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-46 新大阪北ビル

Tel. 06-6393-7411

URL：https://www.tokyoinst.co.jp Mail：sales@tokyoinst.co.jp



超高真空・極低温走査型プローブ顕微鏡  
高速分光測定装置、クライオスタット



Nd:YAGレーザー、Ti:Sレーザー  
OPOLレーザー

- 本カタログに記載されている内容は、改良のため予告無く変更する場合があります。（製品の仕様、性能、価格などはカタログ発行当時のものです）
- 本カタログに記載されている内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されております。
- 本カタログに記載されているメーカー名、製品名などは各社の商標または登録商標です。